

<<统计过程控制与评价>>

图书基本信息

书名：<<统计过程控制与评价>>

13位ISBN编号：9787121002045

10位ISBN编号：7121002043

出版时间：2004-1

出版时间：电子工业出版社

作者：贾新章

页数：186

字数：280000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<统计过程控制与评价>>

内容概要

本书是“电子元器件质量与可靠性技术”丛书之一，介绍如何对电子元器件生产过程进行统计质量控制，包括实施SPC技术、CPK技术和PPM技术的必要性、基本概念和方法，对元器件生产过程应用SPC技术和CPK技术时出现的特殊问题和解决办法，重点在于帮助读者掌握如何解决实际应用中的问题。

?

本书为电子元器件质量与可靠性技术培训教材，对从事质量与可靠性工作的技术人员和管理人员是一本实用的参考资料。

同时也可作为高等院校电子科学与技术、微电子学、应用物理、电子工程和材料科学等有关专业高年级学生及研究生教材，也适于有关领域的科学家、工程师及高校师生参考。

<<统计过程控制与评价>>

书籍目录

第1章 概论 1.1 元器件常规可靠性评价方法存在的问题 1.2 评价元器件内在质量和可靠性的新思路 1.3 电子元器件统计质量控制和评价的技术流程 本章主要结论 习题与思考题第2章 工序能力指数与6 σ 设计 2.1 预备知识——工艺参数分布规律的定量描述 2.2 工序能力的定量表征和工艺成品率 2.3 工序能力指数的常规计算方法 2.4 6 σ 设计 本章主要结论 习题与思考题第3章 电子元器件工艺能力评价 3.1 电子元器件工艺能力评价的特殊问题 3.2 电子元器件CPK \hat{c}_p 的计算 本章主要结论 习题与思考题第4章 SPC与常规控制图 4.1 SPC技术概述 4.2 常规控制图 4.3 常规计量值控制图 4.4 常规计件值控制图——p图和pn图 4.5 常规计点值控制图——c图和u图 4.6 常规控制图的比较分析 本章主要结论 习题与思考题第5章 电子元器件的特殊SPC模块 5.1 嵌套控制图 5.2 回归控制图 5.3 多变量控制图 5.4 缺陷成团控制图模块 本章主要结论 习题与思考题第6章 CPK \hat{c}_p 和SPC实践 6.1 CPK \hat{c}_p 评价实践与注意事项 6.2 SPC实践与注意事项 6.3 测试仪器精密度的评价 本章主要结论 习题与思考题第7章 出厂产品不合格水平(PPM)评价 7.1 电子元器件产品出厂平均质量水平的评定 7.2 PPM在原材料和工艺质量表征方面的应用 本章主要结论 习题与思考题附录A 美国标准“EIA - 557 - A统计过程控制体系”(摘要)附录B 常用数学符号简表附录C 质量控制与管理中常用数学符号参考资料

<<统计过程控制与评价>>

编辑推荐

本书是“电子元器件质量与可靠性技术”丛书之一，重点阐述在生产过程中如何控制和评价电子元器件的内在质量和可靠性。

近20年来，在保证和评价元器件质量与可靠性的观念和方法方面均发生了很大的变化，不但要对产品进行常规测试和试验，而且要求生产厂家采用SPC技术、CPK技术和PPM技术，保证产品是在统计受控的情况下由高水平生产线生产的，具有较高的内在质量和可靠性。

?为了有助于在我国元器件生产研制厂、所及使用单位有效地推广和应用SPC技术、CPK技术和PPM技术，我们在前几年多次举办学习班的基础上，对讲稿进行修改，编写了本书。

<<统计过程控制与评价>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>